

適用規格																						
定 格	使用温度範囲	-35℃～ + 85℃（注1）	保存温度範囲	-10℃～ + 60℃（注2）																		
	電 圧	AC 50 V	適合コネクタ	DF17#(1.0H)～*DP-0.5V(57)																		
	電 流	0.3 A																				
性 能																						
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT																	
構造	外観, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○																	
	表示	目視にて確認する。		○	○																	
電氣的性能	接触抵抗	100 mA(DC又は 1000 Hz)で測定する。	60 mΩ 以下	○	—																	
	絶縁抵抗	DC 100 Vで測定する。	500 MΩ 以上	○	—																	
	耐電圧	AC 150 Vの電圧を 1 分間印加する。	せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	—																	
	総合挿抜力	適合コネクタで測定する。	<table><tr><th>極数</th><th>挿入力 (N) 以下</th><th>抜去力 (N) 以上</th></tr><tr><td>26</td><td>26.0</td><td>2.6</td></tr><tr><td>30</td><td>30.0</td><td>3.0</td></tr><tr><td>60</td><td>60.0</td><td>6.0</td></tr><tr><td>70</td><td>70.0</td><td>7.0</td></tr><tr><td>80</td><td>80.0</td><td>8.0</td></tr></table>	極数	挿入力 (N) 以下	抜去力 (N) 以上	26	26.0	2.6	30	30.0	3.0	60	60.0	6.0	70	70.0	7.0	80	80.0	8.0	○
極数	挿入力 (N) 以下	抜去力 (N) 以上																				
26	26.0	2.6																				
30	30.0	3.0																				
60	60.0	6.0																				
70	70.0	7.0																				
80	80.0	8.0																				
機械的性能	繰り返し動作	50 回の抜き差しを行う。	①接触抵抗：60 mΩ 以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—																	
	耐振性	周波数 10～55 Hz、片振幅 0.75 mmで 3 方向 各 2 時間試験する。	① 1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—																	
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² 、持続時間 11 ms、 正弦半波 3 方向 各 3 回試験する。	① 1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—																	
	定常状態の耐湿性	温度 +40 ± 2℃、湿度 90～95 %中に 96 時間放置する。	①接触抵抗：60 mΩ 以下 ②絶縁抵抗：250 MΩ 以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—																	
環境的性能	温度サイクル	温度 -55 → 5～35 → 85 → 5～35℃ 時間 30 → 10～15 → 30 → 10～15分 を 5 サイクル 試験する。	①接触抵抗：60 mΩ 以下 ②絶縁抵抗：500 MΩ 以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—																	
	半田耐熱性	【 リフロー半田付けの場合 】 《 リフロー部 》 MAX 250℃ピーク 220℃以上 60 秒 以内 《 予熱部 》 150～180℃ 90～120 秒 リフローは同条件にて2回まで可能 【 手半田（リペア）の場合 】 半田ごてで 350℃、3秒の条件にて半田付け を行う。但し、端子に力を加えないこと。	外観の変形及び端子等に 著しいガタがないこと。	○	—																	
	半田付け性	半田温度 245 ℃、浸せき時間 3 s 間 で試験実施する。	半田浸せき面の 95%以上が新しい半田 で濡れていること。	○	—																	
	二酸化硫黄	濃度10ppm、96時間放置する。 （試験規格： J E I D A - 3 9 ）	①接触抵抗：60 mΩ 以下 ②はなはだしい腐食がないこと。	○	—																	
	塩水噴霧	濃度 5 %の塩水、48 時間放置する。	①接触抵抗：60 mΩ 以下 ②はなはだしい腐食がないこと。	○	—																	
備考																						
(注1) 通電時の温度上昇を含みます。																						
(注2) 保存とは基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表し、基板搭載後の無通電状態は、使用温度範囲が適用 されます。エンボス梱包仕様時の保存温度範囲には-10～+50℃となります。																						
試験規格の記載のない試験方法は J I S C 5 4 0 2 を適用している。																						
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日																	
	1	DIS-H-00003088	SH. HOSODA	TS. MIYAZAKI	17. 09. 29																	
			承認	MO. NAKAMURA	05. 03. 25																	
			検 図	TS. MIYAZAKI	05. 03. 25																	
			担 当	YH. MICHIDA	05. 03. 15																	
			製 図	YH. MICHIDA	05. 03. 15																	
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目		図番	SLC4-162761-06																			
HRS	製 品 規 格 表		製品名	DF17(3.0H)～*DS-0.5V(57)																		
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL683	1/1																	